

Istituto Italiano di Tecnologia

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di un microscopio elettronico ad emissione di campo ad altissima risoluzione, completo di colonna ionica al gallio.

Informazioni sulla gara	
ID	469
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	38511000-0
CIG:	8009672E6B
CUP:	B61G17000190007
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	Determina del Direttore Generale Prot. IIT n. 8020/19 del 05/09/2019
RUP:	Paolo Antonio Netti
Per richiedere informazioni:	É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, effettuando il login alla piattaforma ed utilizzando esclusivamente l'area messaggistica denominata "quesiti" presente all'interno della sezione della procedura di gara di che trattasi, entro il giorno 09/10/2019 ore 16:00.
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Istituto Italiano di Tecnologia
Centro di costo:	Ufficio Gare
Destinatario fornitura/servizio:	Servizio di sistema
Aggiudicatario:	FEI Italia Srl
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	616.289,00 €
Data di aggiudicazione:	03 febbraio 2020

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	700.289,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	700.000,00 €
Oneri:	289,00 €
Importo contribuito ANAC:	70,00 €
Garanzia fideiussoria:	14.005,78 €

Criterio di valutazione dell'offerta economica	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	1.1 Proporzionalità inversa sull'offerta
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	10

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	13 settembre 2019 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	09 ottobre 2019 16:00:00
Data scadenza:	15 ottobre 2019 13:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Dichiarazioni integrative
PASSOE
Contributo ANAC
Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Dichiarazione/certificazione sopralluogo
Informativa privacy
Certificazione per la riduzione dell'importo della cauzione
Documentazione ulteriore per soggetti associati
Eventuali documenti integrativi
Dichiarazione di conformità all'originale

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica - REV. 01

Documentazione gara
Bando di gara
Progetto
DUVRI
Disciplinare di gara
Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi
DGUE in formato .pdf
Schema di contratto

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
Spettabile Ente, nel Modulo dichiarazione di offerta economica viene indicato un prezzo Base d'asta pari ad € 699.771,00, anziché € 700.000,00 come riportato nella maschera gara del portale e nello stesso Disciplinare. Chiediamo delucidazioni in merito e se del caso il modello dichiarazione di offerta con l'importo aggiornato. Grazie Cordiali Saluti	Spett.le Operatore Economico, si comunica che l'importo indicato nel "modulo dichiarazione offerta economica" è viziato da mero errore materiale. L'importo corretto, al netto degli oneri per la sicurezza, è di euro 700.000,00. Si è provveduto alla correzione del medesimo.

Criteri punteggiaggio documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
01. Risoluzione a distanza di lavoro ottimale del fascio elettronico a 15KV (modo SE, senza applicare potenziale al campione)	
Risoluzione a distanza di lavoro ottimale del fascio elettronico a 15KV (modo SE, senza applicare potenziale al campione)	4.00
Totale criterio	4.00
02. Risoluzione a distanza di lavoro ottimale del fascio elettronico ad 1kV (modo SE, senza applicare potenziale al campione, con metodo sopra indicato)	
Risoluzione a distanza di lavoro ottimale del fascio elettronico ad 1kV (modo SE, senza applicare potenziale al campione, con metodo sopra indicato)	5.00
Totale criterio	5.00
03. Risoluzione del fascio elettronico a 15kV (modo SE)() al punto di coincidenza e durante il milling FIB	
Risoluzione del fascio elettronico a 15kV (modo SE)() al punto di coincidenza e durante il milling FIB	5.00
Totale criterio	5.00
04. Risoluzione del fascio elettronico a 1kV (modo SE, senza applicare potenziale al campione, con metodo sopra indicato) al punto di coincidenza e durante il milling FIB	
Risoluzione del fascio elettronico a 1kV (modo SE, senza applicare potenziale al campione, con metodo sopra indicato) al punto di coincidenza e durante il milling FIB	4.00
Totale criterio	4.00
05. Punto di coincidenza dei fasci Elettronico e Ionico a distanza analitica	
Punto di coincidenza dei fasci Elettronico e Ionico a distanza analitica	4.00
Totale criterio	4.00
06. Campo visivo al punto di coincidenza in modalità High resolution Imaging mode (Nessuna modalità overview o simili)	
Campo visivo al punto di coincidenza in modalità High resolution Imaging mode (Nessuna modalità overview o simili)	2.00
Totale criterio	2.00
07. Tensione di accelerazione SEM minima applicabile senza applicare potenziale al campione	
Tensione di accelerazione SEM minima applicabile senza applicare potenziale al campione	3.00
Totale criterio	3.00
08. Sistema per condurre analisi a basse tensioni di accelerazione riducendo la landing energy fino almeno a 50eV o meno	
Sistema per condurre analisi a basse tensioni di accelerazione riducendo la landing energy fino almeno a 50eV o meno	2.00

Totale criterio	2.00
09. Rivelatore SE InLens/InBeam/In Column (geometria e posizione rispetto all'asse del fascio elettronico)	
Rivelatore SE InLens/InBeam/In Column (geometria e posizione rispetto all'asse del fascio elettronico)	3.00
Totale criterio	3.00
10. Rivelatore BSE in colonna	
Rivelatore BSE in colonna	2.00
Totale criterio	2.00
11. Rivelatore BSE in camera	
Rivelatore BSE in camera	3.00
Totale criterio	3.00
12. Tavolino motorizzato	
Tavolino motorizzato	6.00
Totale criterio	6.00
13. Corrente di fascio colonna FIB massima	
Corrente di fascio colonna FIB massima	2.00
Totale criterio	2.00
14. Risoluzione colonna FIB a 30kV al punto di coincidenza con metodo "contrast to gradient statistico" e criterio 75/25	
Risoluzione colonna FIB a 30kV al punto di coincidenza con metodo "contrast to gradient statistico" e criterio 75/25	4.00
Totale criterio	4.00
15. Imaging con detector in colonna elettronica e milling FIB simultaneo	
Imaging con detector in colonna elettronica e milling FIB simultaneo	4.00
Totale criterio	4.00
16. Migliore risoluzione in SE ad 1 KV con decelerazione del fascio o tecnica analoga	
Migliore risoluzione in SE ad 1 KV con decelerazione del fascio o tecnica analoga	4.00
Totale criterio	4.00
17. Sistema di Gas Injection	
Sistema di Gas Injection	3.00
Totale criterio	3.00
18. Sistema di scansione e di imaging per acquisire singole immagini di grandi aree ad alta risoluzione	
Sistema di scansione e di imaging per acquisire singole immagini di grandi aree ad alta risoluzione	4.00
Totale criterio	4.00
19. Software di controllo FIB per Nanotomografia 3D	

Software di controllo FIB per Nanotomografia 3D	2.00
Totale criterio	2.00
20. Gestione delle acquisizioni del software di controllo FIB per Nanotomografia 3D	
Gestione delle acquisizioni del software di controllo FIB per Nanotomografia 3D	2.00
Totale criterio	2.00
21. Customizzazione software di analisi e rendering dei dataset 3D	
Customizzazione software di analisi e rendering dei dataset 3D	4.00
Totale criterio	4.00
22. Software di microscopia correlativa	
Software di microscopia correlativa	4.00
Totale criterio	4.00
23. Assistenza remota	
Assistenza remota	4.00
Totale criterio	4.00
24. Training	
Training	4.00
Totale criterio	4.00
25. Garanzia, assistenza e manutenzione	
Garanzia, assistenza e manutenzione	4.00
Totale criterio	4.00
26. Pacchetto assistenza	
Pacchetto assistenza	2.00
Totale criterio	2.00
Totale	90.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica	
Dichiarazioni di offerta tecnica	
Offerta tecnica generata da sistema	
Relazione tecnica	